

Search Notes

Application/Control No.

10/728,597

Examiner

Madeleine AV Nguyen

Applicant(s)/Patent under
Reexamination

ENMEI, TOSHIHARU

Art Unit

2625

SEARCHED

Class	Subclass	Date	Examiner
update		11/30/2006	AV
345	174		
345	169		
455	404.1		
455	344		
379	100.01	11/30/2006	AV

INTERFERENCE SEARCHED

Class	Subclass	Date	Examiner
358	1.15	11/30/2006	AV
379	100/01	11/30/2006	AV
455	3.06	11/30/2006	AV

**SEARCH NOTES
(INCLUDING SEARCH STRATEGY)**

	DATE	EXMR
East	11/30/2006	AV